

令和3年度前期 全学共用機器利用講習会 一覧表  
 詳細は講習会実施要領をご覧ください。

講習番号	機器タイプ	講習名	機器番号	講習装置機種	開催日	開催時間	開催回数	定員	講習会場	申し込み締切日	備考
1	熱分析	DSC講習会	265-2	DSC8270 (リガク)	4月13日(火)、14日(水)	各日10:00-12:00、 14:00-16:00	計4回	各回1名	産業科学研究所 総合解析センター 302号室 (吹田キャンパス)	各日とも2日前まで	
2	NMR	初心者NMR講習会	226	ECA600 (JEOL)	4月14日(水)、15日(木)	各日9:30-12:30、13:30- 16:30	計4回	各回1名	産業科学研究所 総合解析センター 106号室 (吹田キャンパス)	4月12日	測定サンプル持込希望の方は申し込み 時にご相談ください。
3	熱分析	TG-DTA講習会	265-1	TG8120 (リガク)	4月15日(木)、20日(火)	各日10:00-12:00、 14:00-16:00	計4回	各回1名	産業科学研究所 総合解析センター 302号室 (吹田キャンパス)	各日とも2日前まで	
4	NMR	初心者NMR講習会(英語版)	226	ECA600 (JEOL)	4月16日(金)	9:30-12:30、13:30- 16:30	計2回	各回1名	産業科学研究所 総合解析センター 106号室 (吹田キャンパス)	4月12日	
5	質量分析	DART-MS講習会	346	AccuTOF-DART (JEOL)	4月21日(金)	14:00-17:00	1回	1名	産業科学研究所 総合解析センター 303号室 (吹田キャンパス)	4月18日	測定サンプル持込希望の方は申し込み時にご相談 ください。ただし、サンプルはm/z (イオン質量/価 数) が200~600の範囲で、できるだけ純度の高い ものを用意してください。固体サンプルの場合は溶 媒も持参してください。
6	分光分析	波長可変OPOパルスレーザー/ナノ・マイクロ秒時間分解分 光測定システム講習会	109-1~4	109-1 - 波長可変OPOパルスレーザー/ナノ・マイクロ秒時間分解分 光測定システム 109-2 - 高速可視ストロークカメラ (C5680-01) 109-3 背面照射型・冷却CCDカメラ (PIXIS1024B) 109-4 30cmイメージング回折格子分光器 (SP-2358)	4月21日(水)、5月26日(水)	各日10:30-12:00	計2回	各回10名	工学研究科 機械系M1棟M1-526室、 ウルトラクリーンルーム (吹田キャン パス)	各日とも2日前まで	別日時の開催希望は応相談
7	分光分析	紫外可視近赤外分光光度計(UV-Vis/NIR) 講習会	116	紫外可視近赤外分光光度計 (U-4000)	4月21日(水)、5月26日(水)	各日13:30-14:00	計2回	各回5名	工学研究科 機械系M1 棟M1-518室 (吹田キャンパス)	各日とも2日前まで	別日時の開催希望は応相談
8	分光分析	高精度・高分解能・紫外可視近赤外光・スペクトル計測装置講習会	128	高精度・高分解能・紫外可視近赤外光・スペクトル計測装置 (Q8347)	4月21日(水)、5月26日(水)	各日14:30-15:30	計2回	各回5名	工学研究科 機械系M1 棟M1-518室 (吹田キャンパス)	各日とも2日前まで	別日時の開催希望は応相談
9	質量分析	DART-MS講習会 (英語版)	346	AccuTOF-DART (JEOL)	4月23日(金)、6月9日(水)	各日14:00-17:00	計2回	各回1名	産業科学研究所 総合解析センター 303号室 (吹田キャンパス)	各日とも2日前まで	測定サンプル持込希望の方は申し込み時にご相談 ください。ただし、サンプルはm/z (イオン質量/価 数) が200~600の範囲で、できるだけ純度の高い ものを用意してください。固体サンプルの場合は溶 媒も持参してください。
10	表面分析	XPS講習会	347	JPS-9010MC (JEOL)	5月11日(火)、12日(水)、13日 (木)、14日(金)	各日10:00-16:00	計4回	各回1名	産業科学研究所 総合解析センター 101号室 (吹田キャンパス)	5月7日	測定サンプル持込希望の方は申し込み 時にご相談ください。
11	分光分析	CD講習会	362	J-1100 (日本分光)	5月20日(木)、21日(金)	各日10:00-12:00	計2回	各回1名	産業科学研究所 総合解析センター 101号室 (吹田キャンパス)	5月14日	
12	SEM、元素 分析	FE-SEM講習会	369	JSM-F100 (JEOL)	5月21日(金)、24日(月)、25日 (火)	各日9:30-12:30、13:30- 16:30	計6回	各回3名	産業科学研究所 第2研究棟 S-107-1 号室 (吹田キャンパス)	各日とも2日前まで	
13	NMR	多核NMR講習会	226	ECA600 (JEOL)	5月27日(木)、28日(金)	各日10:00-17:00	計2回	各回1名	産業科学研究所 総合解析センター 106号室 (吹田キャンパス)	5月24日	測定サンプル持込希望の方は申し込み 時にご相談ください。
14	X線回折	薄膜X線回折講習会	263	全自動水平型多目的X線回折装置 Smart Lab (リガク)	5月31日(月)、6月1日(火)、2 日(水)	各日13:30-17:00	計3回	各回3名	産業科学研究所 総合解析センター 101号室 (吹田キャンパス)	各日とも2日前まで	
15	X線回折	粉末X線回折講習会	263	全自動水平型多目的X線回折装置 Smart Lab (リガク)	6月7日(月)、8日(火)	各日13:30-17:00	計2回	各回3名	産業科学研究所 総合解析センター 101号室 (吹田キャンパス)	各日とも2日前まで	
16	質量分析	MALDI-TOF/TOF質量分析装置 基礎・応用実習	366	タンデム飛行時間型質量分析計 (MALDI) 島津/KRATOS AXIMA-Performance	6月3日(木)、4日(金)	各日10:00-12:00、 13:00-16:00	計2回	各回4名程度	文理融合型研究棟301 NMR・MS室 (豊中キャンパス)	各日とも前日まで	
17	質量分析	ESI-LIT-Orbitrap 基礎・応用実習	214	リニアイオントラップ-Orbitrap型質量分析計 (ESI・DART) nano- UPLC装備 Thermo Fisher Scientific Orbitrap XL	6月14日(月)、15日(火)	各日13:30-16:30	計2回	各回4名程度	文理融合型研究棟301 NMR・MS室 (豊中キャンパス)	各日とも前日まで	
18	質量分析	高分解能MALDI-TOF/TOF質量分析装置応用実習	367	No.367 タンデム飛行時間型質量分析計 (MALDI) 日本電子 JMS-S3000	6/21(月)	13:00-16:30	1回	2名程度	理学研究科 理学棟オープンラボ1- 1 (豊中キャンパス)	前日まで	
19	SEM	SEM基礎・応用講習	271-1	JSM-7600F (JEOL)	6月8日(火)、9日(水)、10日 (木)	各日13:00-16:30	計3回	各回3名	文理融合型研究棟204 顕微鏡室 (豊 中キャンパス)	各日とも前日まで	
20	TEM	TEM基礎・応用実習	272	JEM-2100 (JEOL)	6月17日(木)、18日(金)、22日 (火)	各日10:00-16:00	計3回	各回3名	文理融合型研究棟204 顕微鏡室 (豊 中キャンパス)	各日とも前日まで	
21	元素分析	蛍光X線講習会	352	ZSX100e (リガク)	6月9日(水)、10日(木)	各日13:00-16:00	計2回	各回3名	産業科学研究所 総合解析センター 101号室 (吹田キャンパス)	各日とも2日前まで	
22	NMR	中級NMR講習会	226	ECA600 (JEOL)	6月24日(木)、25日(金)	各日10:00-17:00	計2回	各回1名	産業科学研究所 総合解析センター 106号室 (吹田キャンパス)	6月21日	測定サンプル持込希望の方は申し込み 時にご相談ください。
23	NMR	中級NMR講習会 (英語による講習)	226	ECA600 (JEOL)	7月2日(金)	10:00-17:00	1回	1名	産業科学研究所 総合解析センター 106号室 (吹田キャンパス)	6月21日	測定サンプル持込希望の方は申し込み 時にご相談ください。
24	元素分析	高周波誘導結合プラズマ (ICP) 発光分光分析装置講習会 (初級)	261	ICPS-8100 (島津製作所)	7月5日(月)、6日(火)、7日 (水)、12日(月)、13日(火)、14 日(水)	各日14:00-17:00	計6回	各回3名	産業科学研究所 総合解析センター 301号室 (吹田キャンパス)	各日とも前日まで	
25	元素分析	高周波誘導結合プラズマ (ICP) 発光分光分析装置講習会 (中級)	261	ICPS-8100 (島津製作所)	7月20日(火)、21日(水)	各日14:00-17:00	計2回	各回3名	産業科学研究所 総合解析センター 301号室 (吹田キャンパス)	各日とも前日まで	
26	元素分析	EPMA講習会	266	JXA-8800R (JEOL)	7月27日(火)、28日 (水)	各日10:00-16:00	計2回	各回4名	産業科学研究所 総合解析センター 102号室 (吹田キャンパス)	各日とも前日まで	測定サンプル持込希望の方はお申し 込み時にご相談ください。
27	熱分析	示差走査熱量計 (DSC) 講習会	380	示差走査熱量計 NEXTA DSC200 (日立ハイテックサイエンス)	未定	未定	1回	1名程度	未定		